



## [iNeTest 时事资讯](#)



### **ASTER公司开发出第一款能够提供完整的可测性分析流程的工具**

#### **ASTER**

科技是在电路板级可测性分析、测试覆盖率分析、电路板浏览器及质量控制产品处于领导地位的供应商，已经发布第一款能够为可测性分析及从产品设计到产品出货的测试覆盖率分析提供完整流程的工具。欢迎于2012年4月25至27号到上海NEPCON展览ASTER展位（1J26）参观。

**[Read more ...](#)**

### **ASTER客户从使用Testway获得的好处**

在评估完ASTER科技可测试分析及测试覆盖率分析工具的“Testway”后，Kontron（德国控创科技）已经在可测性分析标准制定及多重测试方案下测试覆盖率的计算方面实现直接的效益。Testway

可测性分析工具可以让设计者能够在原理图形成阶段对设计进行验证，以保证产品已经包含充足的测试措施，满足产品制造商测试的需求。当使用到例如边界扫描（在元件设计阶段就要求必须正确实施可测性分析）的测试方案的时候，这一点就尤其重要了。同样地，测试工程师可以利用Testway

的测试覆盖率分析工具预估到对应各种各样测试策略的不良覆盖，并且能够识别不良覆盖的具体位置进而可以提高产品的可测率。

**[Read more ....](#)**

### **是不是测试通过就表示是一块良品电路板呢？**

在推动改进电路设计、电路板布局以及测试程序开发中，测试覆盖率是一个关键的考量工具，其保证了最好的产品合格率。Testway已经开发出从MPS到PCOLA/SOQ，再到PPVS若干不同的测试覆盖率计算模型，并定义出如何利用这些不同的模型计算出测试覆盖率量化的值。需要了解更多关于这个主题的信息，请参考在IEEE电路板测试研讨会上发表的一些技术论文。

**[Read more ...](#)**

Contact: Mister Meng Rui

Tel: +86 1350 195 2039

Email: [rui.meng@inetest.com.cn](mailto:rui.meng@inetest.com.cn)